

ADG733/ADG734

特長

- 単電源：+1.8～+5.5V
- 両電源：±3V
- オン抵抗：2.5
- オン抵抗平坦性：0.5
- リーク電流：100pA
- スイッチング時間：19ns
- トリプルSPDT：ADG733
- クワッドSPDT：ADG734
- 小型TSSOPおよびQSOPパッケージ
- 低消費電力
- TTL/CMOSコンパチブル入力

アプリケーション

- データ・アキュイジション・システム
- 通信システム
- リレー置換部品
- オーディオおよびビデオのスイッチング
- バッテリー駆動システム

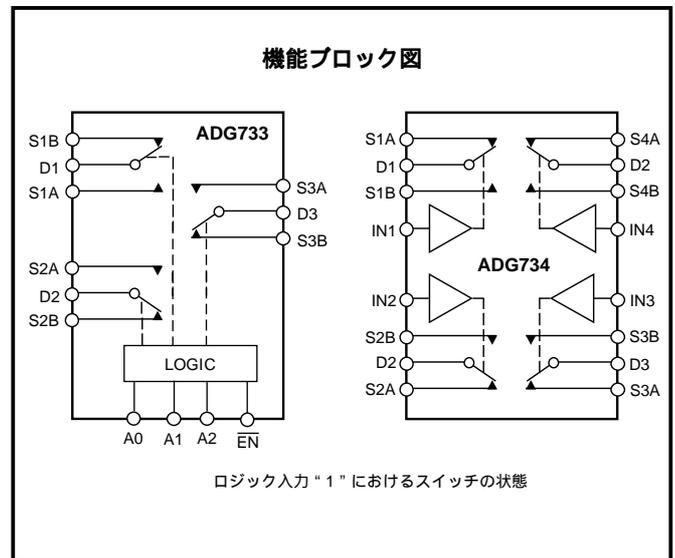
概要

ADG733/ADG734は、それぞれ、3つの独立して選択可能なSPDT（単極二投式）スイッチと、4つの独立して選択可能なSPDTスイッチにより構成されている、低電圧のCMOSデバイスです。

低消費電力で、+1.8～+5.5V単電源および±3V両電源の電源電圧範囲で動作できるので、ADG733/ADG734は、バッテリー駆動機器および携帯型機器に理想的です。全チャンネルはブレーク・ピフォア・メイクの動作を行い、チャンネルを切り替える場合の一時的な短絡を防止しています。ADG733のEN入力は、デバイスのイネーブル/ディスエーブルに使用されます。ディスエーブルにされたときには、全チャンネルがスイッチ・オフされます。

これらの2:1マルチプレクサ/SPDTスイッチは、改良されたサブミクロン・プロセスにより設計され、低消費電力を実現すると同時に、高速スイッチング、非常に低いオン抵抗、広い信号帯域幅、低いリーク電流を実現しています。オン抵抗はわずか2～3程度であり、スイッチ相互間が密接に整合しており、全信号範囲にわたって際だった平坦性を実現しています。両製品は、双方向で同様に良好に動作し、入力信号範囲は電源電圧に達しています。

ADG733は小型のTSSOPおよびQSOPのパッケージで供給され、ADG734は小型TSSOPパッケージで供給されます。



製品のハイライト

1. 単電源および両電源で動作します。ADG733/ADG734は、3Vと5Vの単電源レールおよび±3Vの両電源レールについて、完全な仕様規定と保証がなされています。
2. 低いオン抵抗（代表値：2.5）
3. 低消費電力（<0.01μW）
4. ブレーク・ピフォア・メイクのスイッチング動作を保証。

アナログ・デバイセズ社が提供する情報は正確で信頼できるものを期していますが、その情報の利用または利用したことにより引き起こされる第三者の特許または権利の侵害に関して、当社はいっさいの責任を負いません。さらに、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を許諾するものでもありません。

ADG733/ADG734 - 仕様¹ (特に指示のない限り、 $V_{DD} = 5V \pm 10\%$ 、 $V_{SS} = 0V$ 、 $GND = 0V$)

パラメータ	Bバージョン		単位	テスト条件 / 備考
	25	- 40 ~ + 85		
アナログ・スイッチ アナログ・スイッチ範囲 オン抵抗 (R_{ON})	2.5	0V ~ V_{DD}	V typ	$V_S = 0V \sim V_{DD}$ 、 $I_{DS} = 10mA$
チャンネル間オン抵抗整合 (R_{ON})	4.5	5.0	max	テスト回路1
オン抵抗平坦性 ($R_{FLAT(ON)}$)	0.5	0.1	typ	$V_S = 0V \sim V_{DD}$ 、 $I_{DS} = 10mA$
		0.4	max	
		1.2	typ	$V_S = 0V \sim V_{DD}$ 、 $I_{DS} = 10mA$
			max	
リーク電流 ソース・オフ・リーク I_S (OFF)	± 0.01		nA typ	$V_{DD} = 5.5V$
チャンネル・オン・リーク I_D 、 I_S (ON)	± 0.1	± 0.3	nA max	$V_D = 4.5V/1V$ 、 $V_S = 1V/4.5V$ 、 テスト回路2
	± 0.01		nA typ	$V_D = V_S = 1$ 、または4.5V、 テスト回路3
	± 0.1	± 0.5	nA max	
デジタル入力 入力ハイ電圧、 V_{INH}		2.4	V min	
入力ロー電圧、 V_{INL}		0.8	V max	
入力電流 I_{INL} または I_{INH}	0.005		μA typ	$V_{IN} = V_{INL}$ または V_{INH}
		± 0.1	μA max	
C_{IN} 、デジタル入力容量	4		pF typ	
ダイナミック特性 ² t_{ON}	19	34	ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 3V$ 、テスト回路4
			ns max	
t_{OFF}	7	12	ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 3V$ 、テスト回路4
			ns max	
ADG733 t_{ON} (\overline{EN})	20	40	ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 3V$ 、テスト回路5
			ns max	
t_{OFF} (\overline{EN})	7	12	ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 3V$ 、テスト回路5
			ns max	
ブレーク・ピフォア・メイク時間遅延、 t_b	13	1	ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 3V$ 、テスト回路6
			ns min	
電荷放出	± 3		pC typ	$V_S = 2V$ 、 $R_S = 0$ 、 $C_L = 1nF$ 、 テスト回路7
オフ・アイソレーション	- 62		dB typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、 $f = 10MHz$ 、
	- 82		dB typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、 $f = 1MHz$ 、 テスト回路8
チャンネル間クロストーク	- 62		dB typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、 $f = 10MHz$ 、
	- 82		dB typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、 $f = 1MHz$ 、 テスト回路9
- 3dB帯域幅	200		MHz typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、テスト回路8
C_S (OFF)	11		pF typ	
C_D 、 C_S (ON)	34		pF typ	
電源要求事項 I_{DD}	0.001		μA typ	$V_{DD} = 5.5V$
		1.0	μA max	デジタル入力 = 0Vまたは5.5V

注

- 1 温度範囲は以下のとおり：Bバージョン：- 40 ~ + 85
2 設計により保証されていますが、製品テストの対象となっておりません。
仕様は予告なく変更されることがあります。

仕様¹(特に指示のない限り、 $V_{DD} = 3V \pm 10\%$ 、 $V_{SS} = 0V$ 、 $GND = 0V$)

パラメータ	Bバージョン		単位	テスト条件 / 備考
	25	- 40 ~ + 85		
アナログ・スイッチ				
アナログ・スイッチ範囲		$0V \sim V_{DD}$	V	
オン抵抗 (R_{ON})	6		typ	$V_S = 0V \sim V_{DD}$ 、 $I_{DS} = 10mA$ 、 テスト回路1
チャンネル間オン抵抗整合 (R_{ON})	11	12	max	$V_S = 0V \sim V_{DD}$ 、 $I_{DS} = 10mA$
		0.1	typ	
		0.4	max	
オン抵抗平坦性 ($R_{FLAT(ON)}$)		3	typ	$V_S = 0V \sim V_{DD}$ 、 $I_{DS} = 10mA$
リーク電流				$V_{DD} = 3.3V$
ソース・オフ・リーク I_S (OFF)	± 0.01		nA typ	$V_D = 3V/1V$ 、 $V_S = 1V/3V$ 、 テスト回路2
	± 0.1	± 0.3	nA max	
チャンネル・オン・リーク I_D 、 I_S (ON)	± 0.01		nA typ	$V_S = V_D = 1V$ 、または $3V$ 、 テスト回路3
	± 0.1	± 0.5	nA max	
デジタル入力				
入力ハイ電圧、 V_{INH}		2.0	V min	
入力ロー電圧、 V_{INL}		0.4	V max	
入力電流				
I_{INL} または I_{INH}	0.005		μA typ	$V_{IN} = V_{INL}$ または V_{INH}
		± 0.1	μA max	
C_{IN} 、デジタル入力容量	4		pF typ	
ダイナミック特性 ²				
t_{ON}	28		ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 2V$ 、テスト回路4
		55	ns max	
t_{OFF}	9		ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 2V$ 、テスト回路4
		16	ns max	
ADG733 t_{ON} (\overline{EN})	29		ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 2V$ 、テスト回路5
		60	ns max	
t_{OFF} (\overline{EN})	9		ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 2V$ 、テスト回路5
		16	ns max	
ブレーク・ピフォア・メイク時間遅延、 t_b	22		ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 2V$ 、テスト回路6
		1	ns min	
電荷放出	± 3		pC typ	$V_S = 1V$ 、 $R_S = 0$ 、 $C_L = 1nF$ 、 テスト回路7
オフ・アイソレーション	- 62		dB typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、 $f = 10MHz$ 、
	- 82		dB typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、 $f = 1MHz$ 、 テスト回路8
チャンネル間クロストーク	- 62		dB typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、 $f = 10MHz$ 、
	- 82		dB typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、 $f = 1MHz$ 、 テスト回路9
- 3dB帯域幅	200		MHz typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、テスト回路8
C_S (OFF)	11		pF typ	
C_D 、 C_S (ON)	34		pF typ	
電源要求事項				$V_{DD} = 3.3V$
I_{DD}	0.001		μA typ	デジタル入力 = $0V$ または $3.3V$
		1.0	μA max	

注

1 温度範囲は以下のとおり：Bバージョン：- 40 ~ + 85

2 設計により保証されていますが、製品テストの対象となっておりません。

仕様は予告なく変更されることがあります。

ADG733/ADG734 - 仕様¹

両電源 (特に指示のない限り、 $V_{DD} = +3V \pm 10\%$ 、 $V_{SS} = -3V \pm 10\%$ 、 $GND = 0V$)

パラメータ	Bバージョン		単位	テスト条件 / 備考
	25	-40 ~ +85		
アナログ・スイッチ				
アナログ・スイッチ範囲 オン抵抗 (R_{ON})	2.5	$V_{SS} \sim V_{DD}$	V typ	$V_S = V_{SS} \sim V_{DD}$ 、 $I_{DS} = 10mA$ テスト回路1
チャンネル間オン抵抗整合 (R_{ON})	4.5	5.0	max	
チャンネル間オン抵抗整合 (R_{ON})		0.1	typ	$V_S = V_{SS} \sim V_{DD}$ 、 $I_{DS} = 10mA$
オン抵抗平坦性 ($R_{FLAT(ON)}$)	0.5	0.4	max	
オン抵抗平坦性 ($R_{FLAT(ON)}$)		1.2	typ	$V_S = V_{SS} \sim V_{DD}$ 、 $I_{DS} = 10mA$
オン抵抗平坦性 ($R_{FLAT(ON)}$)			max	
リーク電流				$V_{DD} = +3.3V$ 、 $V_{SS} = -3.3V$
ソース・オフ・リーク I_S (OFF)	± 0.01		nA typ	$V_S = +2.25V / -1.25V$ 、 $V_D = -1.25V / +2.25V$ 、 テスト回路2
チャンネル・オン・リーク I_D 、 I_S (ON)	± 0.1	± 0.3	nA max	
チャンネル・オン・リーク I_D 、 I_S (ON)	± 0.01		nA typ	$V_S = V_D = +2.25V / -1.25V$ 、テスト回路3
チャンネル・オン・リーク I_D 、 I_S (ON)	± 0.1	± 0.5	nA max	
デジタル入力				
入力ハイ電圧、 V_{INH}		2.0	V min	
入力ロー電圧、 V_{INL}		0.4	V max	
入力電流				
I_{INL} または I_{INH}	0.005		μA typ	$V_{IN} = V_{INL}$ または V_{INH}
I_{INL} または I_{INH}		± 0.1	μA max	
C_{IN} 、デジタル入力容量	4		pF typ	
ダイナミック特性 ²				
t_{ON}	21	35	ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 1.5V$ 、テスト回路4
t_{OFF}	10	16	ns max	
t_{OFF}			ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 1.5V$ 、テスト回路4
ADG733 t_{ON} (\overline{EN})	21	40	ns max	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 1.5V$ 、テスト回路5
ADG733 t_{OFF} (\overline{EN})	10	16	ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 1.5V$ 、テスト回路5
ADG733 t_{OFF} (\overline{EN})			ns max	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 1.5V$ 、テスト回路5
ブレーク・ピフォア・メイク時間遅延、 t_D	13	1	ns typ	$R_L = 300$ 、 $C_L = 35pF$ 、 $V_S = 1.5V$ 、テスト回路6
電荷放出	± 5		ns min	$V_S = 1.5V$ 、テスト回路6
オフ・アイソレーション			pC typ	$V_S = 0V$ 、 $R_S = 0$ 、 $C_L = 1nF$ 、 テスト回路7
オフ・アイソレーション	-62		dB typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、 $f = 10MHz$ 、 テスト回路8
オフ・アイソレーション	-82		dB typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、 $f = 1MHz$ 、 テスト回路8
チャンネル間クロストーク				
チャンネル間クロストーク	-62		dB typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、 $f = 10MHz$ 、 テスト回路9
チャンネル間クロストーク	-82		dB typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、 $f = 1MHz$ 、 テスト回路9
-3dB帯域幅	200		MHz typ	$R_L = 50$ 、 $C_L = 5pF$ 、テスト回路8
C_S (OFF)	11		pF typ	
C_D 、 C_S (ON)	34		pF typ	
電源要求事項				$V_{DD} = 3.3V$
I_{DD}	0.001		μA typ	デジタル入力 = 0Vまたは3.3V
I_{DD}		1.0	μA max	
I_{SS}	0.001		μA typ	$V_{SS} = -3.3V$
I_{SS}		1.0	μA max	デジタル入力 = 0Vまたは3.3V

注

- 温度範囲は以下のとおり：Bバージョン：-40 ~ +85
- 設計により保証されていますが、製品テストの対象となっておりません。仕様は予告なく変更されることがあります。

ADG733/ADG734

絶対最大定格¹

(特に指示のない限り、 $T_A = 25$)

$V_{DD} \sim V_{SS}$	7V
$V_{DD} \sim GND$	- 0.3 ~ + 7V
$V_{SS} \sim GND$	+ 0.3 ~ - 3.5V
アナログ入力 ²	$V_{SS} - 0.3V \sim V_{DD} + 0.3V$ または 30mAのうち最初に該当するもの
デジタル入力 ²	- 0.3V ~ $V_{DD} + 0.3V$ または 30mAのうち最初に該当するもの
リーク電流、SまたはD (1msのパルス、最大デューティ・サイクル：10%)	100mA
連続電流、SまたはD	30mA
動作温度範囲	
工業用 (A,Bバージョン)	- 40 ~ + 85
保管温度範囲	- 65 ~ + 150

接合温度

16ピンTSSOP、 J_A 熱抵抗	150
20ピンTSSOP、 J_A 熱抵抗	150.4 /W
16ピンQSOP、 J_A 熱抵抗	143 /W
16ピンQSOP、 J_A 熱抵抗	149.97 /W
ピン温度、ハンダ付け (10秒)	300
赤外線リフロー、ピーク温度	220

注

1 記の絶対最大定格を超えるストレスを加えると、デバイスに永久的な損傷を与えることがあります。この定格はストレス定格の規定のみを目的とするものであり、この仕様の動作セクションに記載する規定値以上のデバイス動作を定めたものではありません。デバイスを長期間絶対最大定格条件に置くと、デバイスの信頼性に影響を与えることがあります。任意の一時点において適用可能な絶対最大定格は1項目のみです。

2 IN、S、Dへの過電圧は内部のダイオードによってクランプされます。電流は、ここに掲載する絶対最大定格に制限しなければなりません。

注意

ESD (静電放電) の影響を受けやすいデバイスです。4000Vもの高圧の静電気が人体やテスト装置に容易に帯電し、検知されることなく放電されることがあります。本製品には当社独自のESD保護回路を備えていますが、高エネルギーの静電放電を受けたデバイスには回復不可能な損傷が発生することがあります。このため、性能低下や機能喪失を回避するために、適切なESD予防措置をとるようお奨めします。

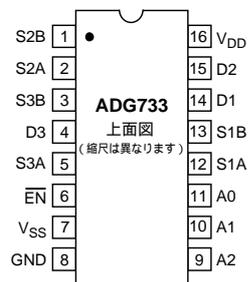


オーダー・ガイド

モデル	温度範囲	パッケージ	パッケージ・オプション
ADG733BRU	- 40 ~ + 85	薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ (TSSOP)	RU-16
ADG733BRQ	- 40 ~ + 85	クォーター・サイズ・アウトライン・パッケージ (QSOP)	RQ-16
ADG734BRU	- 40 ~ + 85	薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ (TSSOP)	RU-20

ピン配置

TSSOP/QSOP



TSSOP



NC = 無接続

ADG733/ADG734

表I ADG733 真理値表

A2	A1	A0	EN	オン・スイッチ
X	X	X	1	なし
0	0	0	0	D 1-S1A, D2-S2A, D3-S3A
0	0	1	0	D 1-S1B, D2-S2A, D3-S3A
0	1	0	0	D 1-S1A, D2-S2B, D3-S3A
0	1	1	0	D 1-S1B, D2-S2B, D3-S3A
1	0	0	0	D 1-S1A, D2-S2A, D3-S3B
1	0	1	0	D 1-S1B, D2-S2A, D3-S3B
1	1	0	0	D 1-S1A, D2-S2B, D3-S3B
1	1	1	0	D 1-S1B, D2-S2B, D3-S3B

X = 任意

表II ADG734 真理値表

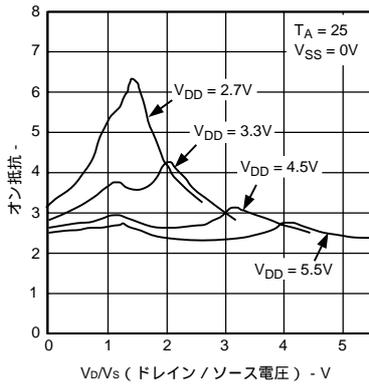
ロジック	スイッチA	スイッチB
0	OFF	ON
1	ON	OFF

用語解説

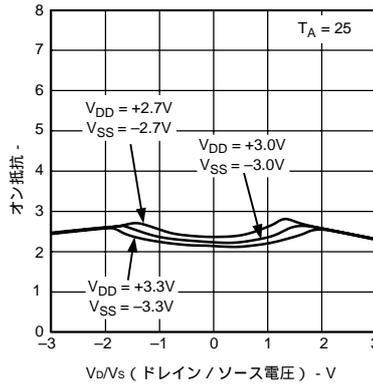
V _{DD}	最も正極性の強い電源電圧。
V _{SS}	両電源アプリケーションにおける最も負極性の強い電源。単電源のアプリケーションでは、このピンをデバイスの近くでグラウンドに接続します。
I _{DD}	正極性の電源電流。
I _{SS}	負極性の電源電流。
GND	グラウンド (0V) リファレンス。
S	ソース端子。入力または出力となります。
D	ドレイン端子。入力または出力となります。
IN	ロジック制御入力。
V _D (V _S)	端子D、Sのアナログ電圧。
R _{ON}	D/S間の抵抗 ()
R _{ON}	任意の2つのチャンネル間におけるオン抵抗の整合、即ち、R _{ONmax} - R _{ONmin} 。
R _{FLAT(ON)}	平坦性。平坦性は、オン抵抗の最大値と最小値の差異と定義され、指定されたアナログ信号範囲にわたって測定されます。
I _S (OFF)	スイッチを「OFF」としたときのソース・リーク電流。
I _D 、I _S (ON)	スイッチを「ON」としたときのチャンネル・リーク電流。
V _{INL}	ロジック「0」における最大入力電圧。
V _{INH}	ロジック「1」における最小入力電圧。
I _{INL} (I _{INH})	デジタル入力の入力電流。
C _S (OFF)	「OFF」スイッチのソース容量。グラウンドを基準として測定されます。
C _D 、C _S (ON)	「ON」スイッチの容量。グラウンドを基準として測定されます。

C _{IN}	デジタル入力容量。
t _{ON}	スイッチが「ON」の状態、デジタル入力の50%の時点と90%の時点の間で測定される遅延時間。
t _{OFF}	スイッチが「OFF」の状態、デジタル入力の50%の時点と90%の時点の間で測定される遅延時間。
t _{ON} (EN)	スイッチが「ON」の状態、ENデジタル入力の50%の時点と90%の時点の間で測定される遅延時間。
t _{OFF} (EN)	スイッチが「OFF」の状態、ENデジタル入力の50%の時点と90%の時点の間で測定される遅延時間。
t _{OPEN}	あるアドレスから他のアドレスへスイッチされるときに、2つのスイッチの80%の時点の間で測定される「OFF」時間。
電荷放出	スイッチングの間にデジタル入力からアナログ入力へ伝送されるグリッチ・インパルス測定値。
オフ・アイソレーション	「OFF」スイッチを通じた不要な信号カップリングの測定値。
クロストーク	寄生容量により、あるチャンネルから他のチャンネルにカップリングされる不要な信号の測定値。
帯域幅	出力が3dB減衰する周波数。
オン応答	「ON」スイッチの周波数応答。
挿入損失	スイッチのオン抵抗による損失。

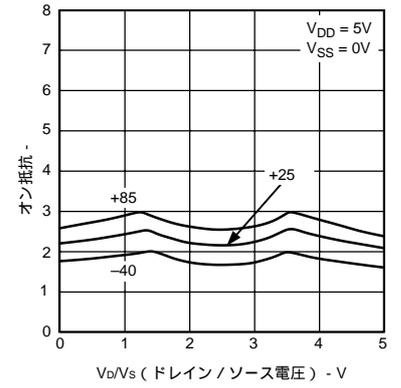
代表的な性能特性 - ADG733/ADG734



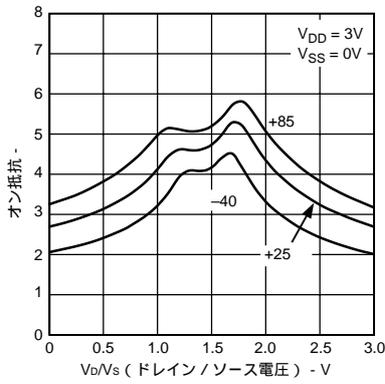
特性1 単電源における V_D (V_S) の関数としてのオン抵抗



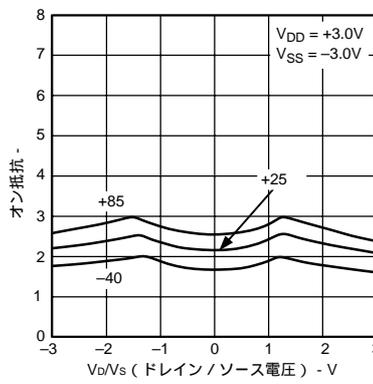
特性2 両電源における V_D (V_S) の関数としてのオン抵抗



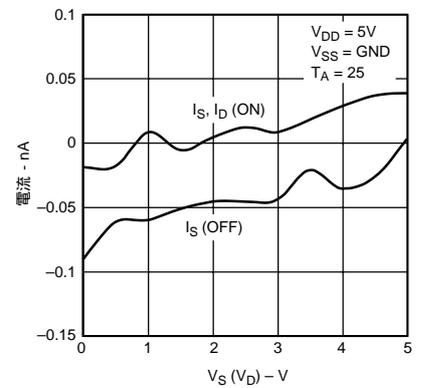
特性3 単電源における異なる温度の V_D (V_S) の関数としてのオン抵抗



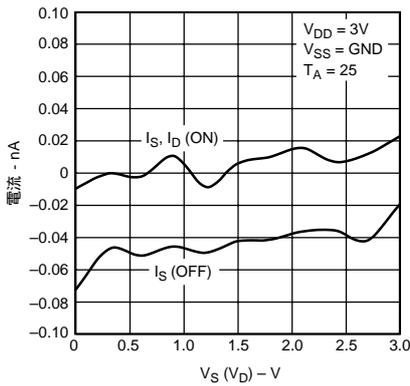
特性4 単電源における異なる温度の V_D (V_S) の関数としてのオン抵抗



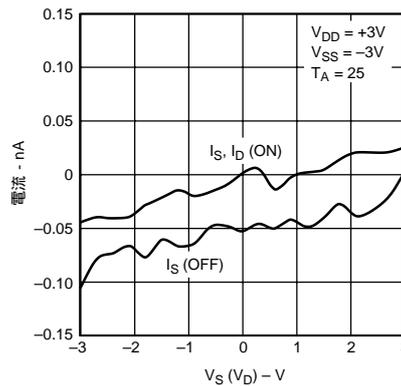
特性5 両電源における異なる温度の V_D (V_S) の関数としてのオン抵抗



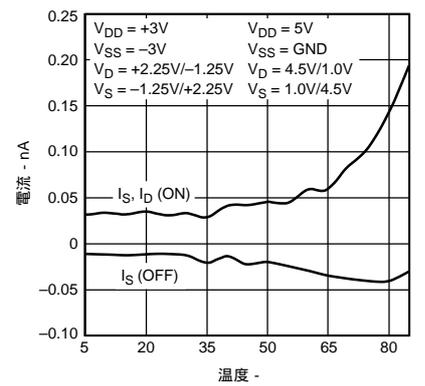
特性6 V_D (V_S) の関数としてのリーク電流



特性7 V_D (V_S) の関数としてのリーク電流

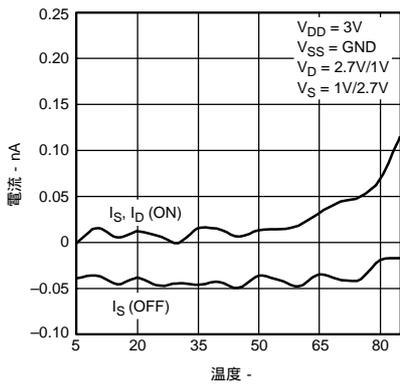


特性8 V_D (V_S) の関数としてのリーク電流

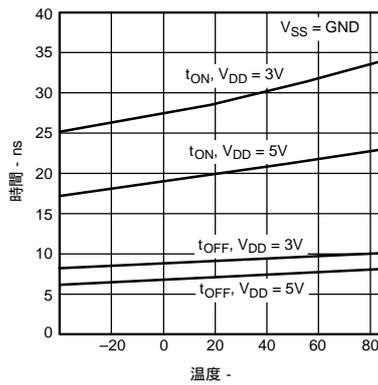


特性9 温度の関数としてのリーク電流

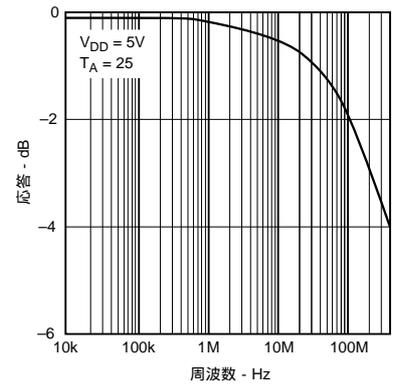
ADG733/ADG734



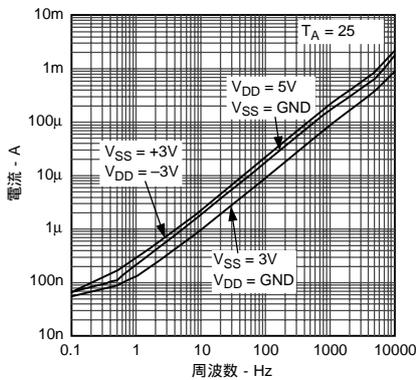
特性10 温度の関数としてのリーク電流



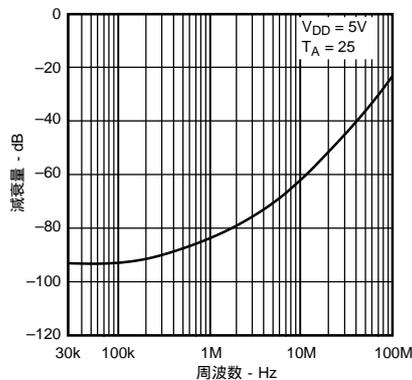
特性11 t_{ON}/t_{OFF} 時間 対 温度



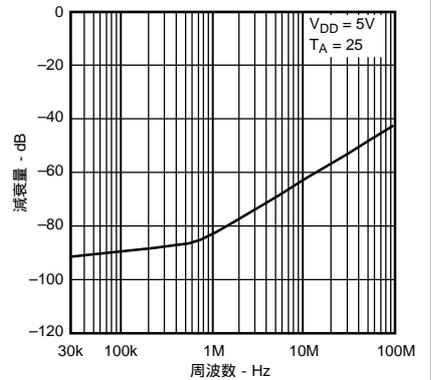
特性12 オン応答 対 周波数



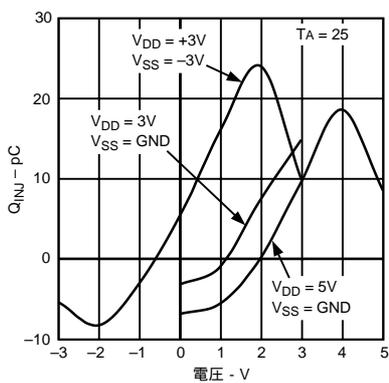
特性13 入力電流、 I_{DD} 対 スイッチング周波数



特性14 オフ・アイソレーション 対 周波数

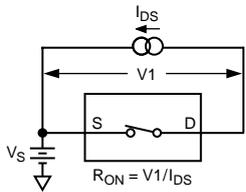


特性15 クロストーク 対 周波数

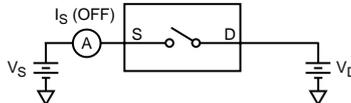


特性16 電荷放出 対 ソース電圧

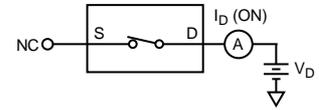
テスト回路



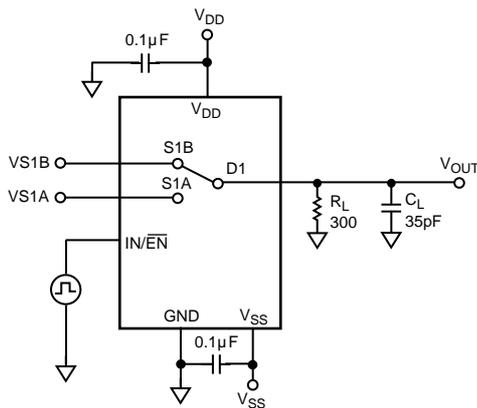
テスト回路1 オン抵抗



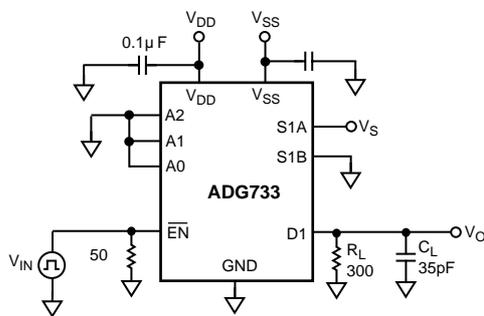
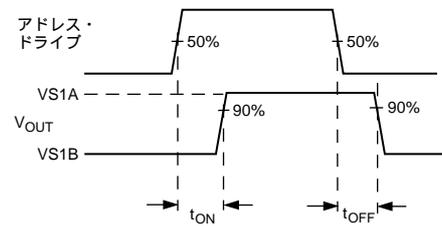
テスト回路2 I_s (OFF)



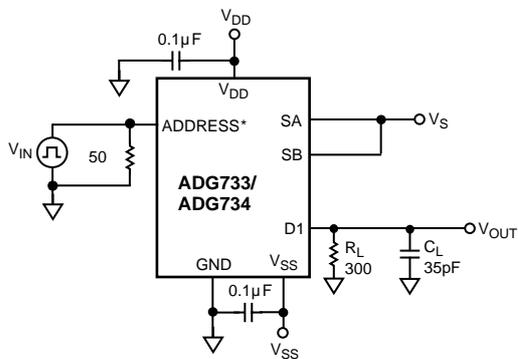
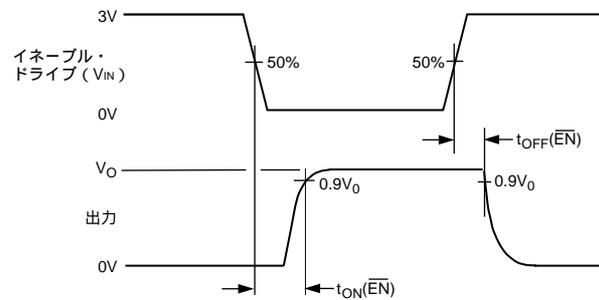
テスト回路3 I_b (ON)



テスト回路4 スwitching時間、 t_{ON} 、 t_{OFF}

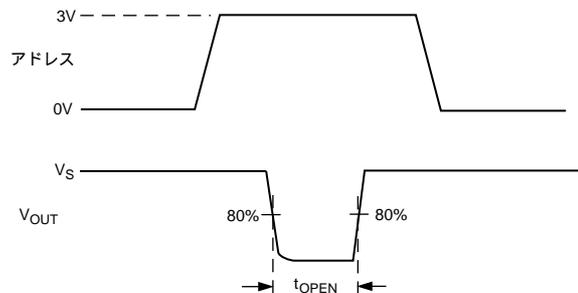


テスト回路5 イネーブル遅延、 $t_{ON}(\overline{EN})$ 、 $t_{OFF}(\overline{EN})$

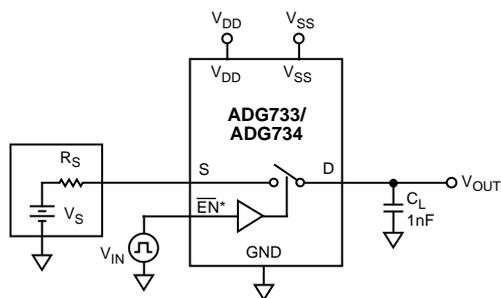


*ADG733についてA0、A1、A2、ADG734についてIN1-4

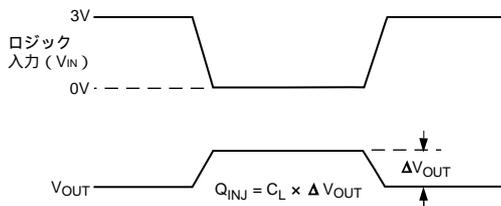
テスト回路6 ブレーク・ピフォア・メイク遅延、 t_{OPEN}



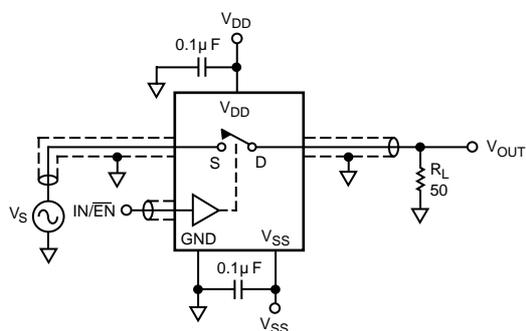
ADG733/ADG734



*ADG734についてIN1-4



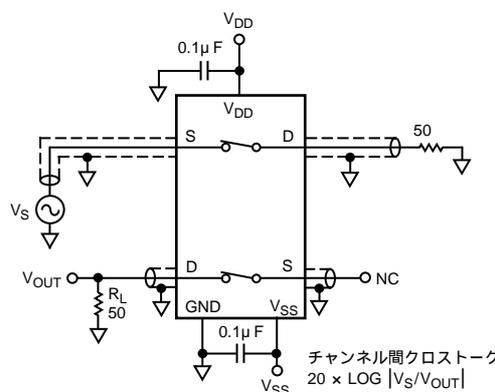
テスト回路7 電荷放出



絶縁の測定ではスイッチ・オープン
 帯域幅の測定ではスイッチ・クローズ
 オフ・アイソレーション = $20\text{LOG}_{10}(V_{\text{OUT}}/V_S)$

$$\text{挿入損失} = 20\text{LOG}_{10} \left(\frac{\text{スイッチありの } V_{\text{OUT}}}{\text{スイッチなしの } V_{\text{OUT}}} \right)$$

テスト回路8 オフ・アイソレーションおよび帯域幅



NC = 無接続

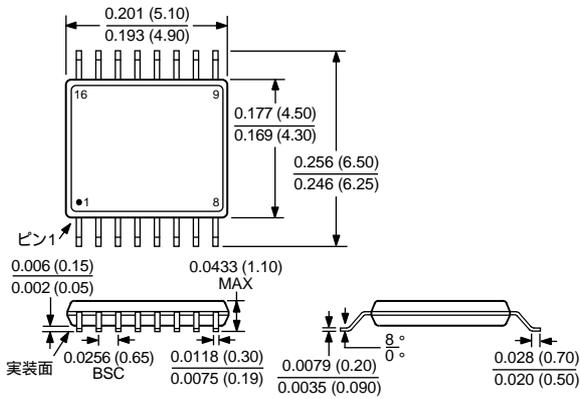
チャンネル間クロストーク
 $20 \times \text{LOG} |V_S/V_{\text{OUT}}|$

テスト回路9 チャンネル間クロストーク

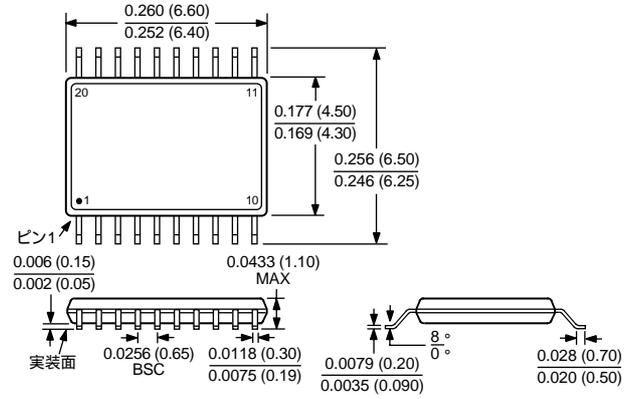
外形寸法

サイズはインチと (mm) で示します。

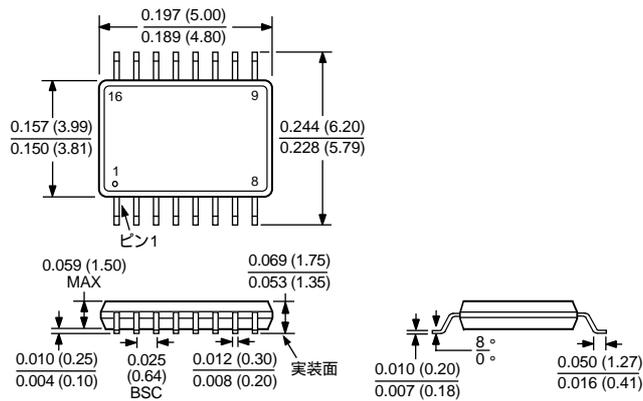
16ピンTSSOP
(RU-16)



20ピンTSSOP
(RU-20)



16ピンQSOP
(RQ-16)



ADG733/ADG734

TDS/03/2001/1000

PRINTED IN JAPAN



このデータシートはエコマーク認定の再生紙を使用しています。